

# XRF 膜厚計・素材分析器

膜厚測定

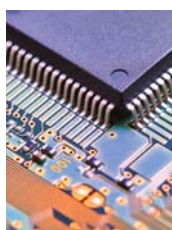
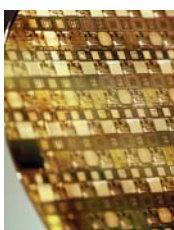
材料分析

液分析

RoHS スクリーニング

多種多様な  
産業に貢献

- 自動車産業
- プリント基板製造
- 半導体製造
- コネクタやリードフレーム製造
- ファスナー
- 切削工具
- 機械工具
- 通信機器
- 宝飾品
- 航空宇宙産業



## 特長

- 最大 5 層\*の各層の厚みと合金比率を同時測定
- 直観的な操作が可能なユーザインタフェース
- X線を集光することで高精度な測定が可能

※ 4被膜層と下地

新製品



# 製品ラインナップ

全ての製品の設計・開発・製造をアメリカで行っています



## G シリーズ

エントリーレベル  
宝飾品や装飾めっき用  
モバイルも可能です



## B シリーズ

電気めっき一般むけ  
測定頻度の少ない  
ユーザーむけ



## P シリーズ

電子部品や半導体部品むけ  
一般の電気めっきに対応



## O シリーズ

測定面が平な電子部品  
半導体部品むけ  
スポットサイズは 80 $\mu$ m 未満  
キャピラリ式



## K シリーズ

30x30cm の測定エリア  
で 22cm 以上の高さに対応



## L シリーズ

大型サンプルに対応



## M シリーズ

測定面が平な電子部品  
半導体部品むけ  
スポットサイズは 30 $\mu$ m 未満  
キャピラリ式



## W シリーズ

リードフレームやウエハー用  
キャピラリ式  
スポットサイズは 7.5 $\mu$ m



## A シリーズ

半導体むけ  
キャピラリ式  
自動機に対応可能  
スポットサイズは 7.5 $\mu$ m

国内総代理店

**NIRECO**  
株式会社ニレコ

制御機器事業部 計測器営業課

〒192-8522 東京都八王子市石川町2951-4  
TEL (042) 660-7353 FAX (042) 660-7354

Web Site <https://www.nireco.jp> Mail [info-mis@nireco.co.jp](mailto:info-mis@nireco.co.jp)

QI5401.0

このカタログの記載事項は、予告なしに変更される場合があります。ご計画の際は、営業部へ確認くださるようお願いいたします。

Printed in Japan